

СПЕКТРОСКОПИЯ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКОГО ТОКА –
НАДЕЖНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФОТОПОЛУПРОВОДНИКОВ

Т.Н. Н а х о д к и н, В.К. П е р е п е л и ц а

Целью настоящей работы является демонстрация возможностей метода спектроскопии фотовольтаического тока для исследования электронной структуры поли-*N*-эпоксипропилкарбазола (ПЭПК) – представителя класса органических молекулярных фотополупроводников.

На рис. 1 приведена спектральная зависимость максимальных квазистационарных значений фотовольтаического тока, измеренная в сандвич-структуре *Al*-ПЭПК-*Al*. Верхней половине рисунка соответствует фотовольтаический ток такого направления, что освещаемый электрод заряжается положительно (J_{Φ}^+), а нижней – от-

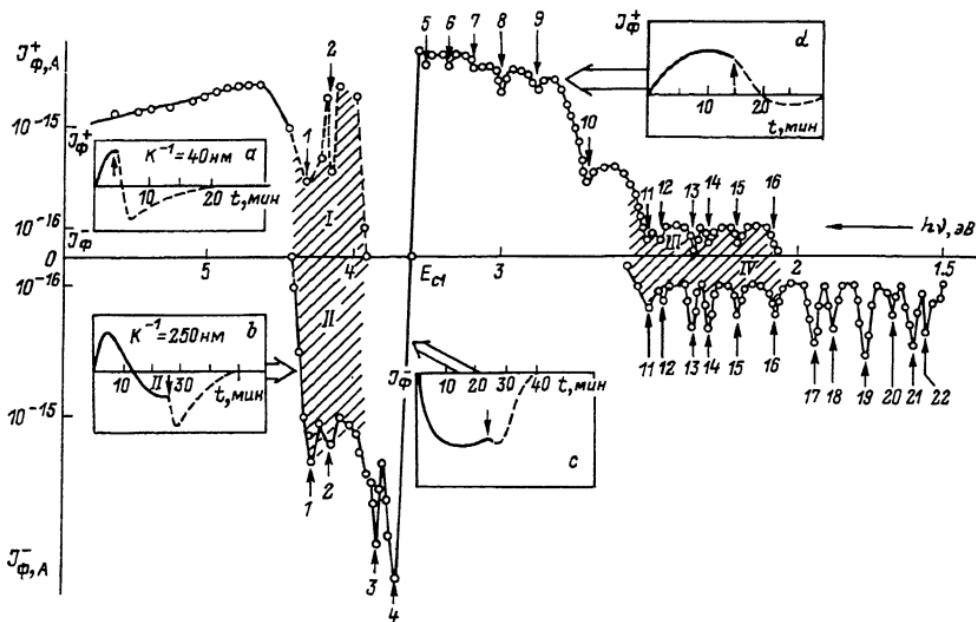


Рис. 1. Зависимость фотовольтаического тока J_{Φ}^{\pm} от энергии квантов ($\hbar\nu$) света в сандвич-структуре *Al*-ПЭПК-*Al*. J_{Φ}^+ направление фотовольтаического тока соответствует положительному, а J_{Φ}^- отрицательно заряженному фронтальному электроду. На вставках α , β , γ , δ приведена кинетика измерения $J_{\Phi}^{\pm}(t)$ в соответствующих спектральных интервалах. В заштрихованных областях I–II, III–IV фотовольтаический ток изменял направление в течение времени измерения.

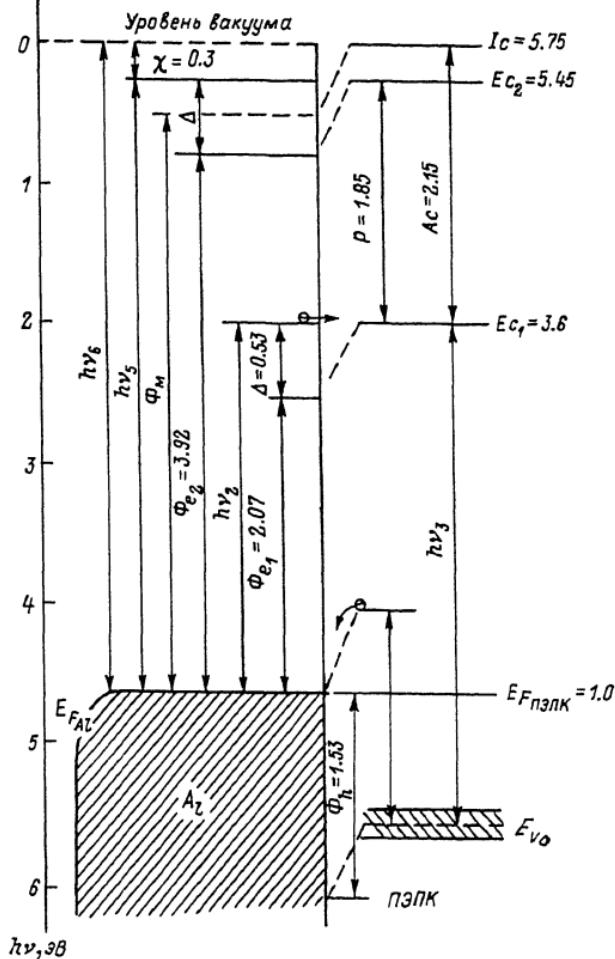


Рис. 2. Энергетическая диаграмма ПЭПК в контакте с алюминиевым электродом относительно уровня вакуума. На диаграмме обозначены: Φ_h — порог инжекции электронов с верхнего валентного уровня ПЭПК — E_{V0} на уровень Ферми $Al - E_{FAl}$; Φ_{e1}, Φ_{e2} — пороги фотоинжекции электронов с E_{FAl} на дно первой (E_{C1}) и второй (E_{C2}) зон проводимости соответственно; Φ_M — работа выхода Al ; χ , A_c — сродство к электрону молекулы и полупроводника ПЭПК соответственно; P — энергия поляризации; I_c — порог внешней фотоэмиссии электронов с E_{V0} ПЭПК; $E_{FPЭПК} = 1.0$ — уровень Ферми ПЭПК; Δ — контактная разность потенциалов Al — ПЭПК.

рицательно (J_φ^-). Зависимость $J_\varphi(h\nu)$ содержит 22 экстремума, коррелирующих с максимумами фототока, поглощения и флуоресценции, что свидетельствует об участии одной и той же системы электронных уровней ПЭПК во всех вышенназванных процессах. Кинетика фотовольтаического тока в различных областях энергий квантов света изображена на вставках a, b, c, d (рис. 1). Стрелками показаны моменты выключения освещения.

Рассмотрим полученные результаты с помощью гипотетической зонной диаграммы ПЭПК в контакте с Al электродом (рис. 2). При энергии квантов света $h\nu > \Phi_h = 1.53$ эВ, соответствующей экстремуму 22 (рис. 1), начинается внутренняя фотоэмиссия электронов с верхнего валентного уровня (E_{V_0}) на локальные уровни в запрещенной зоне ПЭПК. Величина порога внутренней фотоэмиссии Φ_h подтверждается отсечкой зависимости корня квадратного из фототока от энергии квантов света в нулевом поле.

При $h\nu > \Phi_{e_1} = 2.07$ эВ становится возможной инжекция электронов из Al на дно первой дискретной зоны проводимости, величина которой в соответствии с диаграммой равная $E_{C_1} = \Phi_{e_1} + \Phi_h = 3.6$ эВ, близка к ширине запрещенной зоны в родственном материале: поливинилкарбазоле (ПВК) [1].

Процесс фотоинжекции затрудняется наличием контактной разности потенциалов Al -ПЭПК (Δ) и конкурирующим процессом внутренней фотоэмиссии, приводящей к накоплению электронов на локальных уровнях (нейтральных ловушках) и возникновением противоположного для инжекции. Фотовольтаический ток изменяет направление в процессе измерения (затрихованные области III-IV, рис. 1).

При $h\nu > h\nu_2 = \Phi_{e_1} + \Delta = 2.6$ эВ инжекция становится преобладающим процессом, ибо электроны легко преодолевают поле контактной разности потенциалов, а минимумы 5-10 связаны с внутренней фотоэмиссией.

Зная величины Φ_h и Δ , нетрудно оценить положение уровня Ферми в ПЭПК относительно E_{V_0} : $E_{F\text{ПЭПК}} = \Phi_h - \Delta = 1.0$ эВ. Полученная величина совпадает с уровнем Ферми ПВК [2].

При $h\nu > h\nu_3 = E_{C_1} = 3.6$ эВ начинается объемная фотогенерация и разделение электронно-дырочной пары за счет различной подвижности электронов и дырок, что известно для ПЭПК [3]. Наблюдается эффект Дембера.

При $h\nu > \Phi_{e_2} = 3.92$ эВ совместно с объемной генерацией возникает противоборствующий процесс – инжекция электронов во вторую сплошную зону проводимости, величина которой $E_{C_2} = \Phi_{e_2} + \Phi_h = 5.45$ эВ близка к аналогичной в ПВК [4]. Фотовольтаический ток снова изменяет направление за время измерения (заштрихованная область I-II, рис. 1).

При $h\nu > h\nu_5 = \Phi_{e_2} + \Delta = 4.45$ эВ инжекция преобладает над фотогенерацией за счет уменьшения толщины слоя поглощения света с ростом энергии квантов.

После выключения света (см. вставки a , d , рис. 1) фотовольтаический ток изменяет направление, что связано с поляризацией образца и образованием „автофотоэлектретного” состояния.

Зная среднюю работу выхода Al ($\Phi_M \approx 4.2$ эВ), можно оценить величину порога внешней фотоэмиссии ПЭПК: $I_c = \Phi_M + \Phi_h = 5.73$ эВ, которая, по нашим данным, совпадает с энергией максимума поглощения света, лежащего выше экситонных полос поглощения, а также с порогом внешней фотоэмиссии в ПВК [5, 6].

Ширина второй зоны проводимости делокализованных электронов, равная сродству молекулы ПЭПК к электрону, составляет: $\chi = I_c -$

$-E_{C2} = 0.3$ эВ. Сродство полупроводника к электрону $A_C = I_C - E_{C1} = 2.15$ эВ. Величина энергии электронной поляризации $P = A_C - x = E_{C2} - E_{C1} = 1.85$ эВ не расходится с измеренной для карбозола, состоящего скелет мономеров ПЭПК и ПВК [5].

Подобным методом в одном несложном эксперименте предлагаются исследовать всю совокупность энергетических параметров и других фотополупроводников.

В заключение выражаем благодарность профессору В.Н. Добровольскому за полезное обсуждение.

Список литературы

- [1] Но́вио У., Казиуки С. // Дэнси сясин гаккайси, Electro photography. 1987. V.26. N 3. P.231-239.
- [2] Демидов К.Б., Акимов И.А., Газиев З.А. Тез. 1У Всес. конф. „Бессеребряные и необычные фотографические процессы”, Черноголовка, 1983. С. 35.
- [3] Гайдялис В.И., Монтремас Э.А., Пажера А.А. // Лит. физ. сб. 1977. Т. 29. № 3. С. 383-393.
- [4] Giro G., Di Marco P. // Thin Solid Films. 1979. V. 59. P. 91-97.
- [5] Karl N. // J. Chem. Phys. 1972. V. 77. N 10. P. 4870-4878.
- [6] Zielinski M., Porę M. // Ann. Rept. Conf., N.Y. 1984. P. 528-531.

Киевский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко

Поступило в Редакцию
5 мая 1989 г.
В окончательной редакции
20 августа 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 22
06.2

26 ноября 1989 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛЯРНОСТИ *CdTe* МЕТОДОМ СТОЯЧИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ВОЛН

Б.Г. Захаров, А.Ю. Казимиров,
В.Г. Кон, Е.А. Созонтов,
А.Н. Сосфенов

Монокристаллы *CdTe* в настоящее время считаются одними из наиболее важных среди полупроводников группы A_2B_6 для создания новых более эффективных устройств микроэлектроники [1]. Их кристаллическая структура относится к пространственной группе $F\bar{4}3m$ и обладает кристаллографической полярностью вдоль направления 111, которая обнаруживает себя в анизотропии физических